หมวด 1 ส่วนที่ 2 การตรวจค้น

หัวข้อ **หน้า**

1. บทนำ 1
2. การตรวจค้นเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว สำหรับใช้ในขั้นตอน
การตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive Examination) 2
3. สาระสำคัญการตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตร 2
3.1 การตรวจค้นเนื้อหา 2
3.2 การตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆ
แล้วพบความเกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้น 6
4. การอ่านศึกษาเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจค้น 7
5. การค้นหาการจำแนกประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC)
ของคำขอรับสิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตร 7
6. การตรวจค้นสาขาวิทยาการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกัน 8
7. การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิและกำหนดองค์ประกอบในการตรวจค้น 9
7.1 การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิทั้งหมด 10
7.2 การกำหนดองค์ประกอบ (Elements) สำหรับการการตรวจค้น 10
8. การตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพื่อการตรวจสอบสิทธิบัตร 12
8.1.แนวทางการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 12
8.2 การหยุดการตรวจค้น (Termination of Search) 15
9. การตรวจค้นภายใต้เงื่อนไขพิเศษ 16
9.1 การตรวจค้น คำขอรับสิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตร
ให้ครอบคลุมในสาระสำคัญมากกว่าหนึ่งสาขาวิทยาการ 16
9.2 การตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่มี
หลายการประดิษฐ์ในคำขอเดียวกัน 16
10. สาระสำคัญการประดิษฐ์ที่ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจค้น 18
11. เงื่อนไขในการตรวจค้นเพิ่มเติม 18
12. รายงานผลการตรวจค้น 19

หัวข้อ **หน้า**

13. การสร้างรายงานผลการตรวจค้น (TH-DIP Search Report) เพื่อประกอบการพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์และการให้ความเห็นจากการตรวจค้น 20
14. การตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรของคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กรณี 21
14.1 กรณีที่คำขอรับสิทธิบัตรที่เคยยื่นนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย 21
14.2 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย และยังมิได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกันนั้นไว้ในต่างประเทศ ฯ 21
14.3 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสัญชาติไทยและยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไว้ในประเทศไทยเป็นประเทศแรก 22
15. ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจค้น 23
16. บทสรุป **26**
ภาคผนวก